$Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体系的相关系、 晶体结构和磁性能研究^{*}

李 健¹) 宋功保^{1,2}^{*} 王美丽¹) 张宝述¹)

1)(西南科技大学材料科学与工程学院,绵阳 621010)

2 € Department of Ceramics and Glass Engineering, University of Aveiro, Aveiro 3810-193, Portugal) (2006年1月9日收到 2007年1月24日收到修改稿)

采用溶胶凝胶法制备了 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}体系系列样品.利用扫描电子显微镜(SEM),X 射线光电子能谱(XPS),粉 末 X 射线衍射分析(XRD)方法研究了 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}系列样品的颗粒尺寸、形貌、组分化学态、相关系和固溶区范围; 并利用超导量子干涉磁强计对样品的磁性能进行了研究.采用 Rietveld 结构精修的方法研究了 Cr 的不同掺杂量对 TiO₂ 晶体结构的影响,研究表明,1000℃烧结的样品的固溶区范围是 x = 0 - 0.03,为金红石单相,随着 Cr 掺杂量的 增加,金红石相晶胞参数规律性地减小;当 x > 0.03,为金红石相和 CrO₂ 相两相共存.综合 XRD 和磁性测量结果, 500℃烧结的样品的固溶区范围是 x = 0 - 0.02,为锐钛矿单相,随着 Cr 掺杂量的增加,锐钛矿相晶胞参数规律性地 减小;当 $x \ge 0.04$,为锐钛矿相和绿铬矿相(Cr₂O₃)两相共存.XPS 实验结果表明,500℃和 1000℃退火的样品中 Cr 都 是以 Cr⁺³和 Cr⁺⁶两种化学态存在,1000℃烧结的样品中可能有更多的 Cr³⁺转化为 Cr⁶⁺.根据 *M*-*H* 和 *M*-*T* 曲线的测 试结果发现,本文 500℃烧结的 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}体系样品当 x = 0 - 0.02 时,为室温铁磁性.当 $x \ge 0.04$ 时,由铁磁相和 顺磁相所组成,在低温下有较强的铁磁性;室温下主要是顺磁相,铁磁相只占据很小的体积分数.

关键词:Ti_{1-x}Cr_xO_{2±δ}体系,相关系,固溶区,磁性能 PACC:6146,7865,2110K

1.引 言

纳米 TiO₂ 有三种晶相:板钛矿、锐钛矿和金红 石相^[1-6].纳米 TiO₂ 是一种重要的宽禁带纳米半导 体材料,在紫外光区吸收强烈,而对可见光的吸收却 很低^[7].所以,如何提高纳米 TiO₂ 对可见光的利用 率,从而达到实用化,已成为学术界研究的热点问题 之一.通过适当的过渡金属离子掺杂^[8-12],能够改变 TiO₂ 的禁带宽度,达到改善TiO₂ 特性的目的.根据 报道^[12-14],适量的 Cr 掺杂纳米 TiO₂ 能够提高光催 化活性^[12],提高光分解水的能力以及提高传感器的 稳定性和灵敏性.而关于其磁性研究的报道却很 少^[15-17],Droubay等^[16]采用氧气等离子体辅助分子 束外延生长(OPA-MBE)技术在 LaAlO₃(001)基底上 生长出了掺杂 Cr 的锐钛矿相 TiO₂ 薄膜,且室温下 薄膜为铁磁性,但对掺杂量与磁性质的关系以及晶体结构等方面研究的报道较少.本文利用 X 射线粉末衍射分析和 Rietveld 结构精修的方法研究了不同 温度处理的 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\delta}$ 体系相关系、固溶区范围 和晶体结构,结合 X 射线光电子能谱(XPS)的分析 结果研究了 Cr 的化学态,并利用超导量子干涉磁强 计(SQUID)对样品的磁学性能进行了测量.

2.实验

2.1. 实验原料及样品制备

实验原料有:TiCl₄,NH₄OH,HCl,无水乙醇,Cr (NO₃),·9H₂O,以上药品均为分析纯.

采用溶胶凝胶(Sol-Gel)法制备了 Ti_{1-x} Cr_x O_{2±δ} 体系系列样品:将一定量的 C₀(NO₃), ·9H₂O 溶液与

^{*} 四川省教育厅重点专项项目(批准号 2005D006)资助的课题.

[†] 通讯联系人.E-mail:gbsong931@yahoo.com.cn

TiCl₄ 溶液分别滴入蒸馏水中,反应过程中保持搅 拌,同时按比例滴加 NH₄OH 溶液,以调节 pH 值到 中性附近;反应约 4—5 h 后,得溶胶状掺杂体系,然 后过滤、洗涤,于 60℃下干燥 24 h,所得粉末分别在 500℃,1000℃下焙烧 24 h,最后用玛瑙研钵研磨,得 到 Cr 掺杂量分别为 0% 2% 4% 5% 6%,7% 8% 和 11% 的、500℃处理的 CRT0-500,CRT2-500,CRT4-500,CRT5-500,CRT6-500,CRT7-500,CRT8-500 和 CRT11-500系列样品,以及 Cr 掺杂量为 0%,0.5%, 1%,2%,3%,4%和 5%的、1000℃处理的 CRT0-1000,CRT0.5-1000,CRT1-1000,CRT2-1000,CRT3-1000,CRT4-1000和 CRT5-1000系列样品.

2.2. 材料表征

物相鉴定使用日本理学 D/MAX-RPC 型 X 射线 衍射仪(XRD)进行分析,采用 Cu 靶 Kα 辐射(λ = 1.54056 Å),管流 120 mA,管压为 45 kV.用于物相鉴 定的数据采用连续扫描方式,扫描速度为 2 θ = 4°/min,扫描范围为 10°—90°;用于结构精修和晶胞 参数测定的数据采用步进扫描的方式,步宽 2 θ =



0.02° 时间参数为 1 s/步,扫描范围为 10°—90°.颗粒 形貌和粒度分析在英国 S440 型扫描电子显微镜 (SEM)上测定. XPS 测试采用 VG Scientific ESCALab220i-XL型光电子能谱仪分析,激发源为 AlK α X 射线,功率 300 W,分析时的基础真空为 3 × 10⁻⁷ Pa,电子结合能用污染碳的 C1s 峰(284.8 eV)校 正.样品的磁滞回线(*M-H*)和磁化强度随温度的变 化曲线(*M-T*)测试使用的是美国 Quantum Design 公 司生产的 PPMS 测试系统;*M-T* 曲线测试过程是先 在零磁场中将样品冷却(ZFC)至3 K,然后在升温过 程中测量;*M-H* 曲线测试是在300 K下进行的.

3. 实验结果及讨论

3.1. 颗粒大小及其形貌特征

图 1(a)(b)(c)分别为 CRT2-500, CRT0-500, CRT5-1000 样品的 SEM 图.

由图 1(a)(b)可知:样品的粒度分布窄,但由于纳米颗粒表面能较高,颗粒间有一定程度的团聚.





图 1 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}的 SEM 图像 (a)x=0.02 热处理温度 500℃ (b)x=0 热处理温度 500℃ (c)x=0.05 热处 理温度 1000℃

较图 1(b),图 1(a)中的颗粒团聚较弱,纳米颗粒的 边界较清楚,颗粒形态为球形,颗粒大小较均匀,颗 粒的粒度在 40—65 nm 之间,平均粒径为 55 nm.图 1(c)中,颗粒形貌一致,接近球形;与图 1(a)(b)相 比 图 1(c)中粒子的球形有一定程度的畸变,且出 现了多个粒子融合生长的现象,哑铃形等不规则球 形 粒度也明显长大,平均粒径为 500 nm.

3.2. Ti_{1-x}Cr_xO_{2± δ}体系的相关系和固溶区范围

利用日本理学 D/MAX-RPC 型 XRD 对 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\delta}$ 体系系列样品进行了分析,结果如图 2 所示.图 2 (a)表明,对于在 500℃热处理的样品,当掺杂量在 0 $\leq x \leq 0.07$ 时,只有锐钛矿单相;但当 $x \geq 0.08$ 时, 除锐钛矿相外,还出现了绿铬矿相(Cr_2O_3)的特征衍 射峰(d = 2.6653 Å,2.4797 Å,2.1752 Å),并与标准 ICDD 卡片(No.38-1479,空间群 $R\overline{3}c$)一致;而且,随 掺杂量的增加($x \geq 0.08$),其绿铬矿相(Cr_2O_3)衍射 峰强度逐渐增强,而 TiO₂ 锐钛矿相的衍射峰强度则 逐渐下降.这种变化过程说明,在低于掺杂量的临界 值时, Cr^{3+} 以代替 Ti⁴⁺的方式进入了 TiO₂ 的晶格中;



图 2 不同掺杂量 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}体系的 XRD 图 (a)500℃样 品;(b)1000℃样品

当掺杂量超过临界值($x \ge 0.08$)时,有 Cr_2O_3 绿铬矿 相出现,说明掺杂量已超出了其在锐钛矿相 TiO_2 中 的固溶区范围,导致了多余的 Cr^{3+} 在 500℃下以绿 铬矿杂相(Cr_2O_3)的形式存在,也就是说,XRD 分析 结果显示:经 500℃热处理后, $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\partial}$ 体系固 溶区的范围是x = 0—0.07.

由图 χ b)可知 ,1000 °C 下热处理的样品 ,当掺 杂量在 $0 \le x \le 0.03$ 时 ,只有金红石单相 ;但当 $x \ge$ 0.04 时 ,除金红石相外 ,还出现了 CrO₃ 相的特征衍 射峰(d = 4.1900 Å ,3.4350 Å) ,并与标准 ICDD 卡片 (No.32-285 ,空间群 Ama 2)一致 ;而且 ,随掺杂量的 增加($x \ge 0.04$) ,CrO₃ 相的衍射峰强度逐渐增强 ,而 TiO₂ 金红石相的衍射峰强度则逐渐下降 .这种变化 过程说明 ,在低于掺杂量的临界值(x = 0.03)时 , Cr³⁺ 以代替 Ti⁴⁺ 的方式进入了 TiO₂ 的晶格中 ,当掺 杂量超过临界值($x \ge 0.04$)时 ,与 500 °C 下不同 ,过 量的 Cr³⁺ 离子在 1000 °C 下转化为 Cr⁶⁺ ,并以 CrO₃ 相 出现 ;也就是说 ,XRD 分析结果显示 :经 1000 °C 热处 理后 ,Ti_{1-x} Cr_xO_{2±0} 体系 固溶区的范围是 x = 0— 0.03.

3.3. $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 晶体结构分析

利用 DBWS-9411 程序分别对 500 $^{\circ}$ 和 1000 $^{\circ}$ 的 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±0}体系系列样品的晶体结构进行了结构 精修^[18],结构精修初始模型参考文献 19 20].结构 精修获得的晶胞参数结果列于表 1 和图 3.

表 1 和图 3 的结果显示 :晶胞参数 a c n V 与 掺杂量呈现出规律性的变化.500℃热处理下的样 品 ,当 Cr 的掺杂量为 $0 \le x \le 0.07$ 时 晶胞参数 a ,c 和V随Cr掺杂量的增加而规律性地减小,而当Cr 的掺杂量 x > 0.07 时 , a , c 和 V 保持恒定不变; 1000 ℃热处理下的样品,当 Cr 的掺杂量为 $0 \le x \le$ 0.03 时 晶胞参数 a ,c 和 V 随 Cr 掺杂量的增加而 规律性地减小;而当 Cr 的掺杂量 x > 0.03 时, a, c 和 V 保持恒定不变,这个结果证实了我们在 3.2 节 有关 Cr, Ti1-, O2+。体系固溶区的范围的分析结果 ;同 时,根据下面 3.4 节 XPS 的分析结果,500℃和 1000℃下固溶区范围内的样品中 Cr 主要以 Cr^{3+} 的 化学态存在,但都有部分 Cr³⁺ 为平衡电价而以 Cr⁶⁺ 的形式存在 这也从另一方面证实了晶胞参数的变 化规律是较小半径的 Cr³⁺(0.63 Å)和 Cr⁶⁺(0.52 Å) 离子代替较大半径的 Ti⁴⁺(0.68 Å),有效掺杂的必 然结果.



图 3 Cr_xTi_{1-x}O_{2±∂}体系样品的晶胞参数 *a*, *c* 和 *V* 与 Cr 掺杂量 *x* 关系图 (a)500℃样品(b)1000℃样品

表 1 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\delta}$ 体系系列样品的相关系和晶胞参数

| 温度/℃ | x | a | с | v | 相 |
|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------------------------|---|
| | 0 | 3.7927(0) | 9.5091(3) | 136.78(7) | 锐钛矿相 |
| | 0.02 | 3.7886(1) | 9.5045(4) | 136.41(8) | 锐钛矿相 |
| | 0.04 | 3.7877(1) | 9.5003(4) | 136.30(7) | 锐钛矿相 |
| 500 | 0.06 | 3.7858(2) | 9.4889(5) | 136.00(1) | 锐钛矿相 |
| | 0.07 | 3.7852(2) | 9.4860(5) | 135.91(1) | 锐钛矿相 |
| | 0.08 | 3.7852(0) | 9.4860(2) | 135.91(7) | 锐钛矿相 |
| | a | = 4.9587 Å | c = 13.5942 Å | $V = 916.39 \text{ Å}^3$ | $\operatorname{Cr}_2\operatorname{O}_3$ |
| | 0 | 4.5918(1) | 2.9588(0) | 62.384(1) | 金红石相 |
| 1000 | 0.005 | 4.5913(1) | 2.9583(0) | 62.363(2) | 金红石相 |
| | 0.01 | 4.5889(1) | 2.9562(1) | 62.252(2) | 金红石相 |
| | 0.02 | 4.5867(1) | 2.9541(0) | 62.148(1) | 金红石相 |
| | 0.03 | 4.5848(1) | 2.9520(0) | 62.052(2) | 金红石相 |
| | 0.04 | 4.5848(1) | 2.9520(0) | 62.052(2) | 金红石相 |
| <i>a</i> = 5.74 | 94 Å ,ł | o = 8.5560 Å | c = 4.7961 Å , | $V = 235.929 \text{ Å}^3$ | GrO3 |

结构精修获得的原子参数、温度因子 *B* 列于表 2.图 4 为不同热处理温度下 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+3}$ 样品的结 构精修 X 射线衍射分析的观察值、理论值及其差值 图.如表 2 所示,Rietveld 修正结果 *R-wp* = 18%— 23% 与 Lopez 等在相似体系中的精修结果非常相 似^[21],高于 10%,可能是因为纳米颗粒的粒度细小和结晶程度较低的原因。



图 4 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}的 Rietveld 精修图 实线为观测值 (+)为 计算值 (+)为 Bragg 衍射位置 ,底部曲线为差值 (a)500℃烧结 样品 (b)1000℃烧结样品

根据表 2 的 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体系的 Rietveld 结构精 修结果,我们分别计算了 500℃和 1000℃热处理下 样品的阳离子 Ti^{4+} 与氧离子之间的键长,并列于表 3 利用 Brown 价健理论计算了 500℃和 1000℃热处 理下样品中 Ti 的化合价分别为 4.172—4.212, 4.070—4.092^[22],其值接近于正常值,这与 XPS 测得 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体系中 Ti 元素的化合价为 + 4 的结果 相接近,表明 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体系结构精修结果是可 信的.

3.4. Ti_{1-x} Cr_x O_{2±δ}的 XPS 分析

Cr 是一种过渡金属元素,电子排布为 3d⁵4s¹,由 于其外层 s 电子和次外层 d 电子能级接近,除最外 层 s 电子参与成键外,d 电子也能全部或部分参与 成键,形成 多种化合价,因而,有必要对 Ti_{1-x} Cr_xO_{2±δ}体系中 Cr 元素的化合态进行研究,从而准 确地对 Ti_{1-x} Cr_xO_{2±δ}样品开展磁学性质的研究.图 5 为 500℃和 1000℃烧结样品的 XPS 图谱.

| | | | | 1-x-x-210 | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 温度/℃ | 应问册 | 百乙 | 等效点 | <i>x</i> | | | | | | | | |
| | 土间杆 | 尿丁 | 及坐标 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | | | | |
| 500 I | | $\mathrm{Ti}_{1-x}/\mathrm{Cr}_x$ | 4 <i>a</i> 0 ,3/4 ,1/8 | <i>B</i> = 0.39 | | | | |
| | I41/amdz | 0 | 8 e | Z = 0.0821(1) | Z = 0.0828(1) | Z = 0.0820(2) | Z = 0.0821(2) | Z = 0.0823(3) | | | | |
| | | 0 | 0 ,1/4 ,z | <i>B</i> = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | | | | |
| | | R-wp | | 18.36 | 22.81 | 23.07 | 22.49 | 23.14 | | | | |
| 温度/℃ | 穴间野 | 原子 | 等效点 | | | x | | | | | | |
| | 土间杆 | | 及坐标 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | | | | |
| 1000 | | $\mathrm{Ti}_{1-x}/\mathrm{Cr}_x$ | 2 <i>a</i> 0 0 0 | <i>B</i> = 0.39 | | | | |
| | P4 ₂ /mnm | 0 | 4f | x = 0.3050(0) | x = 0.3043(6) | x = 0.3049(6) | x = 0.3035(8) | x = 0.3016(9) | | | | |
| | - | | x ,x Ø | <i>B</i> = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | B = 0.62 | | | | |
| | | R-wp | | 19.30 | 19.73 | 18.29 | 19.79 | 19.41 | | | | |

表 2 Ti_{1-x}Cr_xO₂₊ 体系的 Rietveld 结构精修结果

注:Ti/Cr,0的温度因子 B(Å2)是人为给定,分别为0.39 0.62

表 3 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体系样品键长和化合价

| 温度/℃ | 空间群 | 原子 | 等效点及坐标 | | | | | х | | | | | |
|------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| | | | | 0.00 | | 0. | 02 | 0. | 04 | 0. | 06 | 0.0 | 17 |
| | | | - | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v |
| 500 | $I4_1$ /amdz | | -0(8e)×4 | 1.940 | | 1.936 | | 1.937 | | 1.936 | | 1.935 | |
| | | Ti_{1-x}/Cr_x | | | 4.172 | | 4.172 | | 4.196 | | 4.212 | | 4.212 |
| | | | -0(8e)×2 | 1.969 | | 1.976 | | 1.967 | | 1.965 | | 1.967 | |
| | | | | 0.00 | | 0.0 |)05 | 0. | 01 | 0. | 02 | 0.0 | 13 |
| | | | | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v |
| 1000 | $P4_2/\text{mnm}$ | | -0(4f)×4 | 1.947 | | 1.950 | | 1.946 | | 1.951 | | 1.956×2 | |
| | | Ti_{1-x}/Cr_x | | | 4.076 | | 4.070 | | 4.092 | | 4.088 | | 4.082 |
| | | | $-0(4f) \times 2$ | 1.981 | | 1.976 | | 1.979 | | 1.969 | | 1.958×4 | |

注: d 为键长; v 为化合价.

由文献 23 可知,以 Cr^{3+} 掺杂 TiO₂ 由于三价 Cr 取代四价 Ti 会产生部分 Cr^{6+} 离子以保持 TiO₂ 晶格 中的电价平衡, Cr^{3+} 和 Cr^{6+} 的芯能级分别在576.7 eV 和 579.2 eV,两峰相差 2.5 eV.如图 5(a)(b)所示, 本文 500℃烧结、Cr 掺杂量分别为 4%和 5%的样品 的 XPS 光谱显示:Ti_{1-x} Cr_xO_{2±ð}体系中 Cr 元素相应 的化合态为 + 3 和 + 6 共存, Cr^{3+} 和 Cr⁶⁺的芯能级分 别在 577.2 eV 和579.6 eV,两峰相差 2.4 eV,较文献 报道值分别产生了 0.5 eV 和 0.4 eV 的移动,两峰差 值减小了 0.1 eV;Cr 芯能级的移动及其峰间距的减 小,可能是由于 Cr 取代 Ti 后所处的晶体场的影响 不同所致.如图 5(c)所示,1000℃烧结、掺杂量为 2%的样品的 XPS 光谱也显示出 Cr 元素的化合态为 +3和+6共存, Cr^{3+} 和 Cr^{6+} 的芯能级分别在 576.8 eV和579.6 eV, 两峰相差 2.8 eV, 较图 5(a)中 的差值, 两峰差值增大了 0.3 eV, 这可能是由于锐钛 矿相和金红石相不同的结构环境对 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2\pm\delta}$ 体 系中Cr产生的作用不同所致.

从 XRD 分析结果可知:当掺杂量超过临界值 ($x \ge 0.08(500 \degree)$,或 $x \ge 0.04(1000 \degree)$)时,在 500 °C 和 1000 °C下,过量的 Cr 离子分别以 Cr₂O₃ 绿铬矿相 和 Cr 的高温稳定相 CrO₃ 相形式存在,也就是说在 1000 °C下 Cr³⁺更易于以 Cr⁶⁺ 化学态存在.可以预测: 同样掺杂量的情况下,1000 °C烧结的样品比 500 °C烧 结的 样 品 可 能 有 稍 多 的 Cr³⁺ 以 Cr⁶⁺ 化 学 态 存在.



图 5 Ti_{1-x}Cr_xO_{2±∂}体系样品的 XPS 光谱 (a)(b)为 500℃烧 结样品 Cr 元素的 XPS 光谱 (c)为 1000℃烧结样品 Cr 元素的 XPS 光谱

3.5. Ti_{1-x}Cr_xO_{2± δ}粉体磁性能的探讨

关于 Cr 掺杂的 TiO₂ 材料的磁性能前人报道的

主要是薄膜材料^{16 24 25}],认为室温下 Cr 掺杂 TiO₂ 薄 膜表现为铁磁性特征.本文用 SQUID 法对研究样品 进行了磁滞回线 *M-H*,和磁化强度随温度的变化曲 线 *M-T*)的测试 结果显示本文的 Ti_{1-x} Cr_x O_{2±δ}粉体 样品室温下由铁磁相和顺磁相所组成,下面以 CRT4-500 样品为代表进行说明.

图 6 为 CRT4-500 样品的室温 *M-H* 回线.从该 图可以得出以下两点:一是因为发现有磁滞回线,矫 顽力不大,和相应薄膜材料的文献报道值 $H_c =$ 0.01—0.015 T 接近 经计算得到在 5 T 磁场下,磁化 强度为 0.7 μ_B /Cr 原子;该值虽然小于最大磁矩 2.6 μ_B /Cr 原子^[25],但可以认为该磁矩来自于掺杂到 TiO₂ 晶格中的 Cr 的贡献;同时,该值与 Droubay 等 人^[16]宣布的室温铁磁性 Cr 掺杂 TiO₂ 薄膜样品的饱 和磁化强度 0.6 μ_B /Cr 原子很接近,因此可以认为该 样品确实包含铁磁相,铁磁相对应于掺杂到 TiO₂ 晶 格中的 Cr³⁺ 离子;二是从回线的形状特征可以看 出,样品明显由铁磁相和顺磁相所组成.这一点也可 以从图 7 样品的 *M-T* 曲线得到进一步说明.



图 6 Ti_{0.96} Cr_{0.04} O_{2±δ}的 M-H 曲线

图 χ a)为 CRT4-500 样品的 0.2 T 磁场下的 *M*-T 曲线.图 χ a) *M*-*T* 曲线表明 :该样品磁化强度在 50 K 以下 ,随着温度的升高有一急剧下降 ,说明在 低温下有较强的铁磁性 ;这个结果与 Mukherjee 等 人^[26]在掺杂 Cr 离子的二氧化硅玻璃母体中的 Cr³⁺ 离子的磁性能是完全一致的 ;这里的铁磁性可能源 于两种 Cr³⁺离子 ,一是掺杂到 TiO₂ 晶格中的 Cr³⁺离 子 ,二是来源于由于含量和敏感性原因未被 XRD 测 试出来的 Cr₂O₃ 杂相的磁性能贡献.其次 ,在 55.7 K 时 ,磁化强度有一小的峰值 ,对应于样品的 Neel 温 度和图 χ b) 1/ χ -*T* 曲线中的极小值 ,说明发生了反 铁磁相变 随后 在 300 K 时 磁矩并不等于零 ,而是 有一残存值. XPS 分析结果证实:在 Cr³⁺ 掺杂的 $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\delta}$ 样品中,由于三价 Cr 取代四价 Ti 会产 生部分 Cr6+ 离子以保持 TiO, 晶格中的电价平衡, Mukherjee 等人^[26]研究表明 Cr⁶⁺ 离子是反铁磁性的, 因此 ,这里的反铁磁相应该对应于这部分 Cr⁶⁺ 离 子.另外.图 7(b) $1/\chi$ -T 曲线显示 $1/\chi$ -T 曲线实际 分为两段 低温段几乎可以外插通过坐标原点 这对 应于正常的顺磁相 这里的正常顺磁相可能源于由 于含量和敏感性原因未被 XRD 测试出来的 Cr₂O₃ 杂相的磁性能贡献^[26].在高温段的直线则是对应于 TiO2 晶格中因电价平衡而产生的 Cr6+ 离子反铁磁 相在 Neel 温度以上存在的顺磁性以及杂相 Cr₂O₃存 在的顺磁性^[26];由此分析,室温下,本文样品主要是 顺磁相 而铁磁相只占据很小的体积分数 这个分析 结果和图 6 的磁滞回线所反映的事实也是一致的.



图 7 (a) Ti_{0.96} Cr_{0.04} O_{2±δ}样品在 0.2 T 磁场下的 *M-T* 曲线; (b) Ti_{0.96} Cr_{0.04} O_{2±δ}样品在 0.2 T 磁场下的 1/*χ-T* 曲线

图 8(a)为 CRT2-500 样品的室温 *M-H* 半程回线.从该半程回线可以看出 ,Cr 掺杂 2%的 CRT2-500 样品的 *M-H* 曲线为特征的"S"型 ,表现为较强的铁



图 8 (a)为 Ti_{0.98} Cr_{0.02} O_{2±0}样品的 *M*-*H* 曲线;(b)为 Ti_{0.94} Cr_{0.06} O_{2±0}样品的 *M*-*H* 曲线;(c)为 Ti_{0.93} Cr_{0.07} O_{2±0}样品的 *M*-*H* 曲线

磁性特征,磁性应源于掺杂到 TiO_2 晶格中的 Cr^{3+} 离子.图 & b)为 CRT6-500 样品的室温 *M-H* 半程回线, 图 & c)为 CRT7-500 样品的室温 *M-H* 半程回线,他 们的特点与图 6 掺杂量为 4%的 $Ti_{0.96}Cr_{0.04}O_{2\pm\delta}$ 样品 的 *M-H* 曲线非常相似,但更加趋近于直线,表现出 明显的顺磁性特征.这些特征说明,相对于 Cr 掺杂 2%样品的铁磁性,Cr 掺杂 4% 6%和 7%样品的铁 磁相相对含量逐渐减少,而顺磁相 Cr_2O_3 的含量逐 渐增加.尽管磁性测量和 XRD 技术都是确定材料相 图的重要手段,但考虑到 XRD 技术受组分含量 (5%)和结晶程度的影响,有时磁性测量手段可能更为敏感.从本文 $Ti_{1-x} Cr_x O_{2\pm\delta}$ 体系系列样品(x = 0.02, 0.04, 0.06, 0.07)的磁性测量结果看,500℃烧结的样品中第二相 $Cr_2 O_3$ 杂相在 Cr 掺杂 4%的样品中已经出现, $Cr_2 O_3$ 杂相出现的临界组分应该在0.02 < x < 0.04,因此,综合 XRD 和磁性测量分析的结果,500℃烧结的 $Ti_{1-x} Cr_x O_{2\pm\delta}$ 体系样品的固溶区至少为x = 0—0.02.

4.结 论

本文采用 Sol-Gel 法制备了 Ti_{1-x} Cr_xO_{2±∂}体系系 列样品,并分别在 500℃和 1000℃进行了热处理,其 平均颗粒粒度约为 55 nm 和 500 nm,且粒度均匀. XRD 和 XPS 的分析结果表明,Ti_{1-x} Cr_xO_{2±∂}体系样 品中代替 Ti 的 Cr 可能存在两种化学态,主要为 Cr³⁺,可能部分转化为 Cr⁶⁺;1000℃烧结的样品比 500℃烧结的样品可能有稍多的 Cr³⁺ 以 Cr⁶⁺ 化学态 存在.XRD 分析和 Rietveld 结构精修的结果证明: 1000℃的样品,当 Cr 的掺杂量为 0≤ x ≤ 0.03 时,只

- [1] Song G B, Liu F S, Peng T J, Liang J K, Rao G H 2003 Acta Phys. Sin. 51 2793 (in Chinese)[宋功保、刘福生、彭同江、梁 敬魁、饶光辉 2002 物理学报 51 2793]
- [2] Wang J B , Wu H H , Li Q J , Li Z K , Gu G R , Lu X Y , Zheng W T , Jin Z S 2005 Chin . Phys. 14 2598
- [3] Song G B, Peng T J, Wan P, Li B W 2003 Acta Phys. Sin.
 51 1575 (in Chinese)[宋功保、彭同江、万 朴、李博文 2003 物理学报 51 1575]
- [4] Hu L H, Dai S Y, Wang K J 2003 Acta Phys. Sin. 52 2135 (in Chinese)[胡林华、戴松元、王孔嘉 2003 物理学报 52 2135]
- [5] Huang H, Luo H J, Yao X 2002 Acta Phys. Sin. 51 1881 (in Chinese)[黄 晖、罗宏杰、姚 熹 2003 物理学报 51 1881]
- [6] Zhao K, Zhu F, Wang L F, Meng T J, Zhang B C, Zhao K 2001
 Acta Phys. Sin. 50 1390 (in Chinese) [赵 坤、朱 凤、王莉 芳、孟铁军、张保澄、赵 夔 2001 物理学报 50 1390]
- [7] Li D Z, Zhen Y, Fu X Z 2000 J. Mater. Res. 14 639 (in Chinese) [李旦振、郑 宜、付贤智 2000 材料研究学报 14 639]
- [8] Yuan Z H, Zhang L D 1999 Chem. J. Chinese Univ. 20 1007 (in Chinese)[袁志好、张立德 1999 高等学校化学学报 20 1007]
- [9] Matasunaga T, Okochim M 1995 Environ. Sci. Technol. 29 501
- [10] Li G H , Wu Y C , Zhang L D 2001 Chin . Phys. 10 0148
- [11] Zhang Y, Tang C Q, Dai J 2005 Acta Phys. Sin. 54 0323 (in Chinese)[张 勇、唐超群、戴 君 2005 物理学报 54 0323]

有金红石单相 ,晶胞参数随 Cr 掺杂量的增加而规律 性地减小 ;而当 Cr 的掺杂量 x > 0.03 时 ,金红石相 晶胞参数保持恒定不变 ,同时存在高温相 CrO₃ 杂 相 ,因此 ,1000 °C 下 Ti_{1-x} Cr_xO_{2±δ}体系的固溶区范围 为 0 $\leq x \leq 0.03$.综合 XRD 和磁性测量结果 ,500 °C 烧 结的样品的固溶区范围是 x = 0—0.02 ,为锐钛矿单 相 随着 Cr 掺杂量的增加 ,锐钛矿相晶胞参数规律 性地减小 ;当 $x \ge 0.04$,为锐钛矿相和绿铬矿相 (Cr₂O₃)两相共存.

根据 *M*-*H* 和 *M*-*T* 曲线的测试结果发现,本文 500℃烧结的 Ti_{1-x} Cr_xO_{2±∂}体系样品当 x = 0—0.02 时,为室温铁磁性.当 $x \ge 0.04$ 时,由铁磁相和顺磁 相所组成,在低温下有较强的铁磁性;室温下主要是 顺磁相,铁磁相只占据很小的体积分数.

感谢西南科技大学材料学院 X 光室刘敏老师在 X 射线 衍射工作方面的支持 感谢西南科技大学城建学院周玉林老 师在 SEM 方面的支持 感谢骆军博士在磁学工作上的帮助; 感谢中国科学院化学研究所刘芬老师在 XPS 工作方面的帮 助 感谢北京科技大学刘泉林教授在 Rietveld 结构精修方面 给予的建议.

- [12] Yu X Y, Cheng J J 2001 J. Inorg. Mater. 16 742 (in Chinese) [于向阳、程继健 2001 无机材料学报 16 742]
- [13] Borgarello E, Kiwi J, Graetzel M, Pelizzetti E, Visca M 1982 J. Am. Chem. Soc. 104 2996
- [14] Rajnish K S , Bhatnagar M C 1999 Sens . & Actua . B 56 215
- [15] Kong L G, Kang J F, Wang Y, Liu L F, Liu X Y, Zhang X, Han R Q 2006 Acta Phys. Sin. 55 1453 (in Chinese)[孔令刚、康晋 锋、王 漪、刘力锋、刘晓彦、张 兴、韩汝琦 2006 物理学报 55 1453]
- [16] Droubay T , Heald S M , Hutthanandan V , Thevuthasan S , Chambers S A , Osterwalder J 2005 J. Appl. Phys. 97 046103
- [17] Song H Q, Chen Y X, Ren M J, Ji G 2005 Acta Phys. Sin.
 54 0369 (in Chinese) [宋红强、陈延学、任妙娟、季 刚 2005 物理学报 54 0369]
- [18] Young R A, Sakthivel A, Moss T S, Paive-Santos C O 1995 J. Appl. Cryst. 28 366
- [19] Sanchez E , Lopez T , Gomez R , Bokhimi , Morales A , Novaro O 1996 J. Solid State Chem. 122 309
- [20] Sabine T M, Howard C 1982 J. Acta Crystallographica B 38 701
- [21] Lopez T , Rojas F , Alexander-Katz R , Galindo F , Balankin A , Buljan A 2004 J. Solid State Chem. 177 1873
- [22] Brown I D , Altermatt D 1985 Acta Crystallogr . B 41 244
- [23] Hideki K , Akihiko K 2002 J. Phys. Chem. B 106 5029

[25]

Niemeyer D, Williams DE, Smith P, Pratt KFE, Slater B, [24] Catlow C R A , Stoneham A M 2002 J. Mater. Chem. 12 667 Hong N H , Ruyter A , Gervais F , Prellier W , Sakai J 2005 J.

Appl. Phys. 97 10D323

Mukherjee S, Pal A K, Bhattacharya S 2005 J. Phys. : Condens. [26] Matter 17 3385

Study on phase relations, crystal structure and magnetic properties of $Ti_{1-x}Cr_xO_{2+\delta}$ system *

Song Gong-Bao^{1 (2)}[†] Wang Mei-Li^{1)} Zhang Bao-Shu^{1)} Li Jian¹⁾

1) (School of Material Science and Engineering ,Southwest University of Science and Technology ,Mianyang 621010 ,China)

2) (Department of Ceramics and Glass Engineering , University of Aveiro, Aveiro 3810-193, Portugal)

(Received 9 January 2006; revised manuscript received 24 January 2007)

Abstract

A series of samples of $\text{Ti}_{1-x} \operatorname{Cr}_x \operatorname{O}_{2\pm\delta}$ were prepared by Sol-Gel process. The particle size , morphology , valence , solid solution range, phase relations and magnetic properties of $Ti_{1-x} Cr_x O_{2\pm\delta}$ samples were studied by XRD, SEM, XPS and SQUID measurements. Meanwhile, the Rietveld refinement method was employed to study the effect of Cr doping on the crystal structure of TiO₂. The results show that the solid solution range of both Ti_{1-x} Cr_x O_{2± δ} systems annealed at 1000°C are x = 0—0.03. Their lattice parameters decrease with increasing Cr concentration. The results of both XRD analysis and magnetic measurements show that the solid solution range of both $Ti_{1-x} Cr_x O_{2\pm \hat{\sigma}}$ systems annealed at 1000 °C are x = 0 - 0.02. Cr ions of samples sintered at 500 $^\circ$ C and 1000 $^\circ$ C have two chemical states , Cr⁺³ and Cr⁺⁶ , respectively , while the samples sintered at 1000 $^\circ$ C have much greater Cr⁺⁶ content than the ones at 500 °C. According to the results of M-H and M-T measurements , magnetic properties of $\text{Ti}_{1-x} \text{Cr}_x \text{O}_{2\pm\delta}$ samples sintered at 500 °C with x = 0 - 0.02 are ferromagnetic. When $x \ge 0.04$, they consisted of both ferromagnetic phase and paramagnetic phase. They have stronger ferromagnetic properties at low temperature (50 K). The paramagnetic phase is the main constituent and the ferromagnetic phase has less volume fraction at room temperature.

Keywords : $Ti_{1-x} Cr_x O_{2\pm\delta}$ system , phase relations , solid solution , magnetic properties PACC: 6146, 7865, 2110K

^{*} Project supported by the Special Key Project of Education Department of Sichuan Province, China Grant No. 2005D006).

[†] Corresponding author. E-mail :gbsong931@yahoo.com.cn